电极结构优化对大功率 GaN 基发光二极管 性能的影响*

张剑铭 邹德恕 徐 晨 顾晓玲 沈光地

(北京工业大学北京市光电子技术实验室,北京 100022) (2007年1月24日收到2007年3月27日收到修改稿)

在台面结构的 GaN 基发光二极管(LED)里, 电流要侧向传输, 当尺寸与电流密度加大之后, 由于 n 型 GaN 层和 下限制层的横向电阻不能忽略, 造成了横向电流分布不均匀. 通过优化电极结构, 以减小电流横向传输距离, 制作 出两种不同电极结构的大功率 GaN 基倒装 LED. 通过比较这两种不同电极结构的 GaN 基倒装大功率 LED 的电、光 性能, 发现在350 mA正向电流下, 插指电极结构的倒装大功率 GaN 基 LED 的正向电压为 3.35 V, 比环形插指电极结 构的倒装大功率 GaN 基 LED 高 0.15 V. 尽管环形插指电极结构 GaN 基 LED 的发光面积略小于插指电极结构 GaN 基 LED, 但在大电流下, 环形插指电极结构的倒装 CaN 基 LED 的光输出功率比插指电极结构的倒装大功率 LED 的光 输出功率大. 并且在大电流下, 环形插指电极结构的倒装大功率 LED 光输出功率饱和速度慢, 而插指电极结构的倒 装大功率 LED 光输出功率饱和明显. 这说明优化电极结构能提高电流扩展均匀性, 减小焦耳热的产生, 改善 GaN 基 LED 的性能.

关键词:GaN,发光二极管,电极结构,大功率 PACC:7280E,7360F,7865K,7360D

1.引 言

20世纪 90 年代以来, GaN 基蓝光发光二极管 (LED)的高亮度化实现了红、绿、蓝三基色完备的发 光体系^[1],用 LED 照明的设想就成为现实.高亮度 的蓝光 LED 与特殊的荧光粉物质组合产生橙黄色 光,再与蓝光混合就可以得到白光^[2],在节能照明光 源的应用日趋成熟,深有潜力.由于 LED 的种种优 势,它除了应用在交通指示灯、汽车尾灯、背光源、固 态照明等外,把红、绿、蓝发光二极管按比例组合起 来获得清晰的全彩色显示用于大面积显示屏更是有 广阔的应用前景.目前,商品化的 GaN 基蓝、绿光 LED 一般都是用金属有机化学气相沉积(MOCVD) 技术在绝缘的蓝宝石衬底上外延生长的^[3—6],由于 蓝宝石不能导电,必须利用台面结构,因此欧姆接触 的 p型电极和 n 型电极只能在外延片表面的同一 侧 图 1 所示是常规 GaN 基 LED 的结构,在台面结 构的 GaN 基 LED 里,电流要侧向传输,由于 n 型 GaN 层和下限制层的横向电阻不能忽略,使得靠近 n 型电极的台面边缘电流密度大于靠近 p 型电极焊 盘的地方,导致了电流拥挤效应^[78].对大面积大功 率的器件来说,电流拥挤会更严重.优化电极几何形 状^[9—11].改变电流通道路径,减小横向电阻,可以使 电流扩展均匀.

在倒装结构 GaN 基 LED 中,由于是背面出光,p 电极采用厚电极,外加电压在整个p区上均匀分布, 在纵向上可以实现均匀的电流分布.当 LED 尺寸与 电流密度加大之后,n-GaN 电阻不可忽略,造成了横 向电流分布不均匀.以常规 GaN 基 LED 的块状电极 为例,在 LED 内部某点的电流密度可以定义为⁸¹

 $f(x) = f(0) \exp(-x/L_s),$ (1) 其中 f(0)为 p 台面边缘处的电流密度 L_s 为电流横 向扩展的最大距离 ,即电流密度为 f(0)的 1/e 时的 x 值 ,具体表达式为

$$L_{\rm s} = \sqrt{\left(\rho_{\rm c} + \rho_{\rm p} t_{\rm p}\right) t_{\rm n} / \rho_{\rm n}} , \qquad (2)$$

^{*} 国家重点基础研究发展计划(973)项目(批准号 2006CB604902),北京市人才强教计划项目(批准号 105002015200504)和国家高技术研究 发展计划(863)(批准号 2006AA03A121)资助的课题.

其中 ρ_e 为 p 型接触电阻 , ρ_p , ρ_n 分别为 p 型 GaN 层 和 n 型 GaN 层的电阻率 , t_n 为 n 型 GaN 层的厚度 , t_n 为 p 型 GaN 层的厚度.



图 1 常规 GaN 基 LED 结构示意图

由(1)式可知,块状电极的 LED,其电流密度随 离开台面边缘的距离增加而呈指数衰减.而当大功 率 GaN 基 LED 采用插指电极结构时,相当于多个 pn 单胞并联,可以缩短电流横向扩展长度,降低串联 电阻,通过电流互补实现相对均匀的电流分布.单胞 数在增加的同时,还可以有效增大侧面出光面积,有 利于提高器件的效率,然而势必以牺牲有源区面积 为代价,二者均衡考虑是优化设计的出发点.

对于大功率 GaN 基倒装 LED ,本文提出了两种 不同的电极图形 ,一种称之为插指电极 ,即 n 电极插 在 p 电极中 ,n 电极的每个指是孤立的 ,如图 ((a)所 示 ;另一种称之为优化的环形插指电极 ,n 电极也是 插在 p 电极中 ,但 n 电极的每个指通过一个环状电 极连接在一起 ,如图 ((b)所示.用两种电极图形制 作的大功率 GaN 基倒装 LED 芯片具有相同的面积. 可以看到 ,图 2(a)中 n 电极在芯片的一侧 ,电流扩 展都要从 p 区域到达 n 区域 ,或经插指流向 n 电极 ,



图 2 大功率 GaN 基 LED 的两种不同电极结构 (a)插指电极; (b)环形插指电极

电流都要聚集在 p, n 交界的区域;而图 χ b)中 n 电 极分布在芯片两侧,并用环形电极连接起来,电流一 部分可以通过 p 区域到达两端 n 电极,一部分则可 以从 p 区经环形路径扩展到 n 电极.如设图 χ b)中 的电极结构中从 p 至 n 的扩展路径 *l* 的平均值为 $l_{\rm B}$ 图 χ a)电极结构中的扩展路径 *l* 的平均值为 $l_{\rm A}$, 那么 $l_{\rm B} < l_{\rm A}$,也就是说图 χ b)电极结构更有利于使 电流扩展均匀.

2. 大功率 GaN 基倒装 LED 的制作

为了验证以上分析,本文用图2所示的两种电 极图形来制作大功率 GaN 基倒装 LED,然后对其 电、光性能进行比较.

本文使用 Veeco D180 MOCVD 系统 以蓝宝石为 衬底,三甲基镓(TMGa)和高纯氨(NH,)分别作为Ga 和 N 源 二茂镁 Cp2 Mg)与硅烷 SiH4)分别作为 p 型 与n型掺杂剂.先在蓝宝石衬底上淀积一层 n-GaN 缓冲层 然后生长 n-GaN ,再生长 n-GaN 下限制层, 之后生长 5 周期的 InGaN/GaN 多量子阱 ,最后生长 200 nm 的 p-GaN 盖层,掺杂浓度为 5 × 10¹⁹.随后在 相同外延片上采用两套不同电极图形的版图制作大 功率 GaN 基倒装 LED 芯片.其制作过程大致如下: 1)在外延片顶部的 p-GaN 淀积厚度为 10/50 nm 的 NiAu/Al 层,用于欧姆接触和背反射.2)采用掩模选 择刻蚀掉 p 型层和多量子阱有源层 ,露出 n 型层. 3) 淀积、刻蚀形成 n 型欧姆接触层 ,芯片尺寸为 1 mm×1 mm.4)然后磨片、划片、裂片,最后把每个 分离的金属化凸点的 GaN 芯片倒装焊接在具有防 静电保护二极管(ESD)的硅支架(submount)上,再把 此倒装的 LED 芯片装配到 TO-3 基座上.5)通过倒 装 GaN 芯片的硅支架与管壳底盘进行电气连接.制 作完成的 LED 芯片用半导体参数测试系统测量器 件的 I-V 特性,用校准的 Si 光电探测器积分球来测 试光输出功率 这里用来进行电、光测试的芯片都是 压焊好没有用环氧树脂封装的裸芯片.

3. 结果与讨论

用半导体参数测试仪测试两种倒装 LED 的正向电流-正向电压(*I-V*)特性,测试结果如图 3 所示. 由图 3 可以看出,350 mA 正向电流下,插指电极结构倒装大功率 GaN 基 LED 的正向电压为 3.35 V,而 环形插指电极结构的倒装大功率 GaN 基 LED 为 3.2 V 相差 0.15 V.由于采用同一片外延片,欧姆接 触制作工艺条件也完全相同,而且都是采用倒装结 构,所以电极结构不同导致电流分布不均匀,引起电 流拥挤是导致电压升高的主要原因.



图 3 不同电极结构倒装大功率 GaN 基 LED 的 I-V 特性

我们测量 GaN 基倒装大功率 LED 在不同电流 下的光输出功率 ,发现随着正向注入电流增加 ,光输 出功率呈亚线性增加 ,但是当电流大于某个值时 ,光 输出会出现饱和 ,在饱和区域 ,光输出不再随着注入 电流增加而增加 ,反而会下降 ,说明注入的部分电子 是以非辐射的形式释放自身能量的.在 LED 器件 中 ,产生光输出饱和的可能原因有载流子溢出和自 身发热等.Guo 等人^[12]用不同占空比的脉冲电流研 究 GaN/InGaN LED 光输出饱和特性 ,发现当注入占 空比小的脉冲电流时 ,光饱和现象不明显 ,表明热的 产生是光功率饱和的主要原因.

本文测试的不同电极结构的倒装大功率 GaN 基 LED 光输出功率 P 与正向电流 I 的关系如图 4 所示.从图4可以看出,在小电流时,环形插指电极 倒装大功率 GaN 基 LED 的光输出功率略小于插指 电极倒装大功率 LED 的光输出功率,这是由于环形 插指电极结构的 GaN 基 LED 发光面积略小于插指 电极的 ,当然在小电流下 ,电流扩展不平衡对器件的 性能影响还不明显,所以光输出功率差别不大,随着 电流的增加,不同电极结构的倒装大功率 GaN 基 LED 的光输出功率都增大,但环形插指电极结构的 倒装 GaN 基 LED 增加的速度快,说明环形插指电极 的电流扩展均匀 增加了器件的有效发光区,当电流 增加到 800 mA 电流时 插指电极结构的倒装大功率 LED 光输出趋于饱和,而环形插指电极结构的倒装 大功率 LED 光输出还有增加的趋势,在 1000 mA 光 输出还未出现饱和[13],并且随着电流的增加,两者

的差距增大.



图 4 不同电极结构倒装大功率 GaN 基 LED 光输出功率与正向 电流的关系

我们认为插指电极结构制作的 GaN 基倒装大 功率 LED 外接电流后 电流由 p 区都流向 n 电极或 经插指流向 n 电极 ,从而 p ,n 电极交界区域尤其 n 电极端在器件工作的过程中集聚了大量电流,导致 这部分区域电流密度很大 产生很多焦耳热 而在其 他区域由于电流分散地流向 n 电极的插指区 ,使得 这个区域的电流密度小很多,产生的焦耳热也小很 多.在器件工作过程中, p, n 交界区温度过高, 使这 部分区域的有源区非辐射复合增加,内量子效率下 降且过高的工作温度很容易使光输出饱和.而在其 他区域流过有源区的电流密度将相对的要小 ,离 n 电极区域越远电流密度越小 ,使这些区域有源区的 辐射复合的能力减弱,而导致总辐射功率和发光效 率的降低,而环形插指电极结构的倒装大功率 GaN 基 LED 的 n 电极分布在芯片两端,这种情况下器件 接通电流后,外接电流从p电极流向环形n电极,或 流向插指电极 或直接流向 n 电极焊盘 这样电流自 均衡地分散着流向 n 电极 ,器件的电流分布更加均 匀 避免了因电流集中在局部而产生很多焦耳热 造 成光输出饱和,而且环状插指电极有利于散热,所以 其光输出饱和现象不明显.

4.结 论

本文通过优化电极几何形状,提出了两种不同 的电极结构,并制作出两种不同电极结构的大功率 GaN 基倒装 LED.通过比较这两种不同电极结构的 GaN 基 倒装大功率 LED 的电、光性能,发现在 350 mA正向电流下,插指电极结构的倒装大功率 GaN 基 LED 的正向电压为 3.35 V,比环形插指电极 结构的倒装大功率 GaN 基 LED 高 0.15 V.尽管环形 插指电极结构 GaN 基 LED 的发光面积略小于插指 电极结构 GaN 基 LED 的,但在大电流下,环形插指 电极结构的倒装 GaN 基 LED 光输出功率比插指电 极结构的倒装大功率 LED 的光输出功率大.并且环 形插指电极结构的倒装大功率 LED 光输出饱和速度慢,在 1000 mA 正向电流下还未出现饱和.这说明优化电极结构能提高电流扩展均匀性,改善了 GaN 基 LED 的性能.

- [1] Nakamura S "Mukai T Senoh M 1994 Appl. Phys. Lett. 64 1687
- [2] Damilano B ,Grandjean N ,Pernot C ,Massies J 2001 Jpn. J. Appl. Phys. Part 2 L918
- [3] Wierer J J Steigerwald D A ,Krames M R ,O 'Shea J J ,Ludowise M J ,Christenson G ,Shen Y C ,Lowery C ,Martin P S ,Subramanya S , Gotz W ,Gardner N F ,Kern R S ,Stockman S A 2001 Appl. Phys. Lett. 78 3379
- [4] Xu B ,Yu Q X ,Wu Q H ,Liao Y ,Wang G Z ,Fang R C 2004 Acta Phys. Sin. 53 204 (in Chinese)[徐 波、余庆选、吴气虹、廖 源、王冠中、方容川 2004 物理学报 53 204]
- [5] Li Z H ,Yu T J ,Yang Z J ,Feng Y C ,Zhang G Y ,Guo B P ,Niu H B 2005 Chin . Phys. 14 1009
- [6] Liu N X , Wang H B , Liu J P , Niu N H , Han J Shen G D 2006 Acta

Phys. Sin. **55** 1424 (in Chinese) [刘乃鑫、王怀兵、刘建平、牛南辉、韩军、沈光地 2006 物理学报 **55** 1424]

- [7] Eliashevich I ,Li Y ,Osinsky A 1999 Proc. SPIE. 3621 28
- [8] Guo X Schubert E Y 2001 J. Appl. Phys. 90 4191
- [9] Guo X Schubert E Y Jahns J 2001 Pro. SPIE. 4278 133
- [10] Kim H , Park S , Hwang H , Park N M 2002 Appl. Phys. Lett. 81 1326
- [11] Kim H Lee J M ,Chul H ,Kim S W ,Kim D J ,Park S J ,Hwang H 2000 Appl. Phys. Lett. 77 1903
- [12] Guo X Schubert E Y 2001 Appl. Phys. Lett. 78 3337
- [13] Zhang J M Zou D S ,Xu C ,Zhu Y X ,Liang T ,Da X L ,Shen G D 2007 Chin . Phys. 16 1135

Zhang Jian-Ming Zou De-Shu Xu Chen Gu Xiao-Ling Shen Guang-Di

(Beijing Optoelectronic Technology Laboratory ,Beijing University of Technology ,Beijing 100022 ,China)
(Received 24 January 2007 ; revised manuscript received 27 March 2007)

Abstract

Due to the lateral current transport in the mesa-structure GaN based LEDs the resistance of the n-type material of the GaN and lower confinement layer is not negligible for large area and high applied current density applications , which causes the current spreading nonuniformly along the lateral direction. With an optimized contact scheme to reduce the length for the lateral current transport , two different kinds of contact schemes of high-power GaN-based flip-chip LEDs (FCLEDs) are fabricated. It is shown that the forward voltage of this FCLED with interdigitated contact scheme is 3.35 V at forward current 350 mA , and exceeds that of FCLEDs with optimized ring-shaped interdigitated contact scheme by 0.15 V. Although the light emitting area of FCLEDs with optimized ring-shaped interdigitated contact scheme is slightly smaller than that of FCLEDs with interdigitated contact scheme , it is found that the light output from the former is larger than that from the later at higher injection currents. Furthermore , the light output from the FCLEDs with interdigitated contact scheme , indicating that the saturation behavior of the FCLEDs with interdigitated contact scheme , indicating that the saturation behavior of the FCLEDs with interdigitated contact scheme is more pronounced. It is confirmed that an optimized contact scheme , which leads to the more uniform current spreading , can decrease joule heat generated and considerably improve the electrical and optical characteristics of the FCLEDs.

Keywords: GaN , light emitting diode , contact scheme , high-power **PACC**: 7280E , 7360F , 7865K , 7360D

^{*} Project supported by the National Basic Research Program of China (Grant No. 2006CB604902), the Talent Promoting Education of Beijing , China (Grant No. 05002015200504) and the National High Technology Research and Development Program of China (Grant No. 2006AA03A121).